Na 含有複合窒化物評価における NMR 利用

極限計測ユニット 強磁場 NMR グループ 丹所 正孝

1. 背景・目的

固体 NMR 法による測定はターゲットとなる核種の周りの電 子状態の影響でスペクトルが変化するため、局所構造の解析の ために主に用いられる。ここでは代表例として Na 含有複合窒 化物評価における NMR 利用の例をとりあげる。

新規に合成された物質において、結晶部分が単一相であるか どうかは粉末エックス線回折測定と Rietveld 解析の組み合わせ などにより評価が可能であるが、非晶質部分が含まれている場 合の評価には不十分である事が多い。他方、固体 NMR 測定に おいては、非晶質部分と結晶性部分の測定感度に大きな違いは ないため、合成試料中の非晶質部分の検出に威力を発揮する事 が多い。本研究では Na 含有α'-サイアロンと同様の結晶構造を 持つと思われる Na-Ge-Ga-O-N 系新物質について、固体²³Na NMR 測定により、新物質中の非晶質部分を評価した。¹⁾⁻³⁾

2. 研究成果

試料の合成は Na₂CO₃, GeO₂, Ga₂O₃ 粉末の混合物の窒素ガ ス還元法により行い、Na_xGe_{12-(m+n})Gam+nOnN_{16-n} (ターゲット 組成は $x = m = 0.50 \sim 2.00$ 、 n=0) を得た。得られた試料及び その後洗浄処理を行った組成の異なる試料について、日本電子 製固体高分解 NMR 装置 ECA500 (¹H の周波数換算で 500MHz) 及び ECA800 (¹H の周波数換算で 800MHz) によ り ²³Na MAS NMR 測定を行った。また、比較のため、Na 周 りの配位数の異なると思われる NaGe₂N₃についても測定した。

ECA500の測定結果の一部を図1に示す。いずれの組成にお いても2本と思われる信号がNaGe2N3より高磁場側に現れた。 このことから Na に対する N 配位数は NaGe2N3とは異なるこ とがわかる。エックス線構造解析では単一相であるとの結果で あった事から、メインピークまたは右肩の成分のいずれかが非 晶質部分である可能性が高い。

さらに詳細に分析するため ECA800 で測定した。いずれの組 成においても同様の傾向が観らたが、そのうち、x = m = 1.50の組成のケースについて図2に示す。磁場の向上による高分解



化学シフト(ppm)

図1 ECA500 で測定した NaxGe12-(m+n)Gam+nOnN16-n の²³Na MAS NMR 測定結 果。

(上)比較のため測定した NaGe₂N₃

(中)組成ターゲット x = m
= 1.00、n=0の試料
(下)組成ターゲット x = m
= 1.50、n=0の試料

能化の効果で図1の右肩のピークはよりはっきりと分離できた。ここで、洗浄処理前試料の通常測定(繰り返し時間30秒)では強度比の大きく異なる2本の²³Naの信号が観測された

(上)が、繰り返し時間を0.5秒に短くした測定では、右側の 信号の相対強度が増加した(中)。通常、緩和時間(結晶部分)
緩和時間(非晶質部分)である事から、相対信号強度が増加 した右側の信号が非結晶相であり、減少した左側の信号が結晶 部分であると推測される。洗浄処理後の試料の測定では、右側 の緩和時間の短い部分の信号が殆ど消えた(下)事から、洗浄 後は結晶部分のみがほぼ単一相として残ったことがわかる。¹⁾⁻³⁾

3. 展望

中期計画期間の途中から固体高分解能 800MHzNMR 装置が動き始めた事により、通常より高い分解能での測定成果が得られ始めている。とはいえ、元々溶液用の装置であったものを導入したため、固体測定の一部にしか現状で対応していない。今後の装置の改善によって、応用が広がる事が期待される。

参考文献

1) Xue, X.; Stebbins, J. F. *Phys. Chem. Minerals* 1993, *20*, 297.

Koller, H.; Engelhardt, G.; Kentgens, A. P. M.; Sauer, J. J.
 Phys. Chem. 1994, *98*, 1544.

3) Suehiro, T.; Tansho, M.; Shimizu, T. *Inorg. Chem.* 2016, *55*, 2355.



図2 ECA800 で測定した Na_xGe_{12-(m+n})Gam+nOnN₁₆-n (組成ターゲットはx=m= 1.50、n=0)の²³Na MAS NMR 測定結果。 (上)洗浄処理前試料の通常 測定 (中)洗浄処理前試料の非晶 質部分をクローズアップし た測定 (下)洗浄後試料の通常測定